高速・高精度
High Accuracy, Speed

4W検査
4W inspection

スキャナカード
scanner card

μOPEN検査
μOPEN inspection

検査ポイント
最大16kピン
Max 16k Test Points

WRμ-SHORT
WRμ-SHORT inspection

SPARK検出
SPARK detection

ベアボード、フレキ等の回路パターン検査、ハーネスの検査に！

For pattern testing of bare board and flexible printed circuits. Testing for harness is also available.

豊富なオプション群から必要な機能の追加ができる最新機能を盛り込んだフラットケーブル対応の最新テスト！

Upgradable to the best suited test system by adding functions from variety of options.

High Speed

OPEN検査

LEAK検査

既存テストとの
検査速度比較において
圧倒的な優位性を確保
Ensures overwhelming
superiority in inspection
speed compared to existing
testers

※検査時間はネット構成や判定閾値等の条件により異なります。

μOPEN

熱破壊防止

Spark Detection

Spark ▶ SHORT

Spark ▶ OPEN

WRμ-Short

Spark防止

Chain Spark ▶ OPEN/SHORT

仕様 | Specifications

モデル Model	RZ-1207
標準検査項目 Inspection items	OPEN/LEAK
導通検査 OPEN inspection	1Ω~100kΩ (10~250V)
絶縁検査 LEAK inspection	10kΩ~100MΩ (10V~250V)
オプション Options items	4端子検査、μOPEN検査、WRμ-SHORT検査、SPARK検出機能等 4W inspection, μOpen inspection, WRμ-SHORT inspection, SPARK detection etc
検査速度 Test time	OPEN検査: 135μs/point (50V/20mA/100Ωjudge) LEAK検査: 150μs/point (250V/20mA/20MΩjudge) ※At Parallel Test
検査ピン数 Points	Max 16,384 points (Applicable to increase and decrease of pins by each 64pins.)
搭載メカ Mechatronics	自動メカ、手動メカ、卓上メカ等 (他社メカへの接続は特注検討要) Variety of Mechatronics. Automatic, Manual and Desktop etc.